

DF20NC15

150V 20A

特長

- SMD
- 低 $I_R=0.4\text{mA}$
- 熱暴走を起こしにくい

Feature

- SMD
- Low $I_R=0.4\text{mA}$
- Resistance for thermal run-away

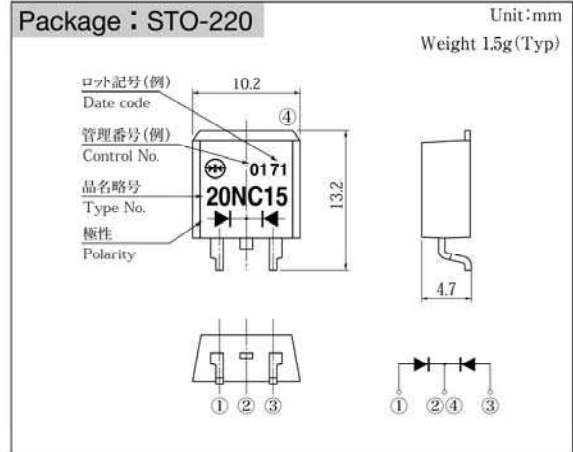
用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 家電、OA
- 通信

Main Use

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Office Automation
- Communication

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

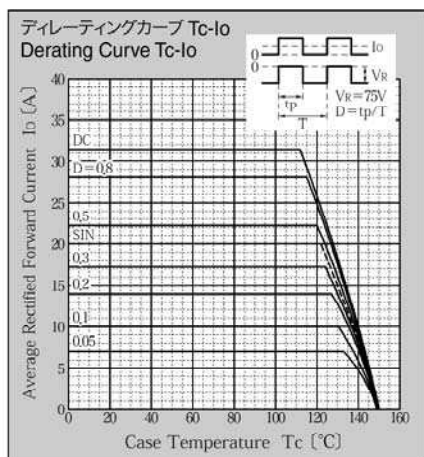
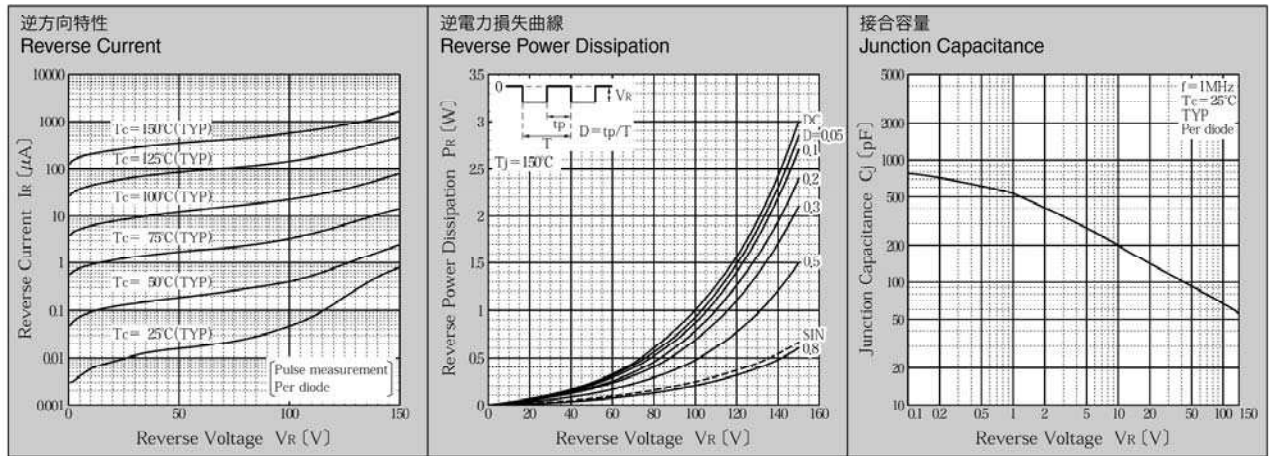
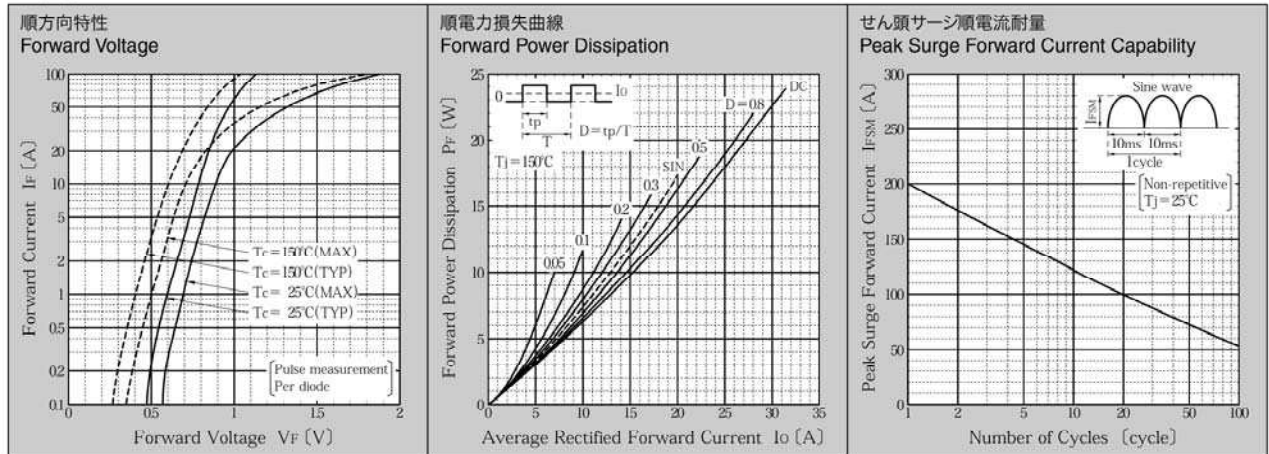
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_C = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF20NC15	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			150	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz正弦波、抵抗負荷、 1素子当りの出力電流平均値 $I_o/2$, $T_C = 121^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode $I_o/2$, $T_C = 121^\circ\text{C}$		20	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波、非繰り返し1サイクルせん頭値、 $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		200	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_C = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Per diode	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 10\text{A}$, パルス測定、1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.88	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定、1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.4	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 200	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.6	$^\circ\text{C}/\text{W}$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical is統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.